

La Sociedad Mexicana de Cristalografía (SMCr)

Invita al



X CONGRESO NACIONAL DE CRISTALOGRAFÍA

2 AL 4 DE DICIEMBRE, 2020



**EVENTO
EN LÍNEA
CUPO
LIMITADO**

CONSULTA LA CONVOCATORIA

Descarga el programa de actividades



**CONFERENCIAS
MAGISTRALES**



CURSOS



PONENCIAS



**PRESENTACIÓN
DE CARTELES.**

Más información

 <https://smcr.mx/>

Hora	Día 1 2 de diciembre		Día 2 3 de diciembre	Día 3 4 de diciembre
8:15 – 8:30			Preparativos	
8:30 – 8:45			Inauguración	
8:45 – 9:00	Preparativos			Preparativos
9:00 – 10:00	Uso de la Base de datos PDF-4+ T. Blanton (ICDD, USA)	Curso de refinamiento Rietveld por Difracción TOPAS (Bruker)	Conferencia Magistral 1 (inaugural): "Crystallography in chocolate" M.A. Cuevas-Diarte (Universitat de Barcelona, Spain)	Conferencia Magistral 3: "A personal history of using crystals and crystallography to understand biology and advanced drug discovery" T. Blundell (Cambridge University, UK)
10:00 – 10:15			Intermedio	Intermedio
10:15 – 12:15			Conferencia Invitada 1: "Magnetic crystallography: multiferroic materials" J. Rodríguez-Carvajal (Institut Laue-Langevin, France)	Conferencia invitada 2: "Crystal structures of large-volume commercial pharmaceuticals" J. A. Kaduk (Illinois Institute of Technology, USA) Por confirmar fecha
			Ponencias 1 y 2	Ponencias 5 y 6
12:15 – 12:30			Intermedio	Intermedio
12:30 – 13:00			Presentación de posters seleccionados	Presentación de posters seleccionados
13:00 – 14:30	Receso	Receso	Receso	Receso
14:30 – 14:45				
14:45 – 15:00	Preparativos			
15:00 – 15:15	Polimorfismo J.A. Henao (Universidad Industrial de Santander, Colombia)	Identificación de fases por Difracción EVA (Bruker)	Preparativos	Preparativos
15:15 – 15:30				
15:30 – 16:30			Conferencia Magistral 2: "The mechanism of lytic polysaccharide monooxygenases: what can we learn from neutron diffraction" F. Meilleur (Oak Ridge National Laboratory, USA)	Conferencia Magistral 4: "Caracterización mineralógica y cristalográfica de arcillas y ejemplos de su aplicación en diferentes disciplinas" T. Pi (Instituto de Geología, UNAM, México)
			(Oak Ridge National Laboratory, USA)	(Instituto de Geología, UNAM, México)
16:30 – 16:45			Intermedio	Intermedio
16:45 – 18:45			Conferencia Invitada 3: "Una mirada al arte y a la arqueología con técnicas de rayos X" C. Vázquez (Universidad de Buenos Aires, Argentina)	Conferencia Invitada 4: "Estructura, morfología y propiedades. Casos de estudio" G. Rodríguez-Gattorno (CINVESTAV-Mérida, México)
			Ponencias 3 y 4	Ponencias 7 y 8
18:45 – 19:00				Clausura
19:00 – 19:15				